



# 國立高雄大學統計學研究所 巨量資料研究中心 聯合演講

## A Day in the Life of Board Level Reliability Engineer within NXP

講者 | 黃則緯可靠度工程師

(台灣恩智浦半導體股份有限公司)

時間 | 2024年5月22日(星期三)下午3:30-4:30

地點 | 統計所多媒體教室(理學院 320室)

茶會 | 下午3:00 於統計所辦公室(理學院 325室)

### 摘要

- About me
- Semiconductor industry overview
- NXP introduction
- What is Board level reliability
  - Board level temperature cycling
  - Board level Drop testing
  - Failure mode and mechanism
- Weibull analysis introduction
  - Theory
  - How do we apply Weibull analysis in reliability test

近期演講內容: <https://statsite.nuk.edu.tw/>

高大交通資訊: <https://statsite.nuk.edu.tw/p/412-1037-5044.php?Lang=zh-tw>



(高大統計所)

敬請公告

歡迎參加